Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Image not found or type unknow

Державний обліковий номер: 0514U000156

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 18-03-2014

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Борча Мар'яна Драгошівна

2. Borcha Mariana Dragoshivna

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: доктор наук

Аспірантура/Докторантура: ні

Шифр наукової спеціальності: 01.04.07

Назва наукової спеціальності: Фізика твердого тіла

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 29-11-2013

Спеціальність за освітою: 0701

Місце роботи здобувача: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Код за ЄДРПОУ: 02071240

Місцезнаходження: 58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 76.051.01

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Код за ЄДРПОУ: 02071240

Місцезнаходження: 58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 29.19

Тема дисертації:

1. Багатохвильові спектри розсіяння Х-променів та електронів у реальних кристалах, багатошарових і нанорозмірних системах

2. Multi-beam spectra of X-ray and electron scattering in real crystals, multi-layred and nano-scaled systems

Реферат/анотація:

1. Розвинуто теоретичні і експериментальні методи прецизійного визначення періодів ґраток та їх змін при деформації кристалу і зміні його температури; встановлені механізми та закономірності формування багатохвильових профілів інтенсивності Х-променів на топограмах, косселеграмах, дифрактограмах азимутального сканування та дифракційних картинах Кікучі. Методика розрахунку та графічного представлення багатохвильових дифрактограм азимутального сканування кристала в схемі Реннінгера була вдосконалена для застосування в багатошарових системах, для яких характерна наявність градієнта періода гратки по товщині. Запропоновано нові підходи визначення планарного розподілу локальних деформацій у кристалах з картин дифракції зворотно відбитих електронів з використанням методу гістограм та методу дискретного двомірного Фур'є перетворення.

2. On the basis of features of two- and multi-beam X-ray diffraction the theoretical and experimental methods were developed for precision determination of lattice parameters and its changes due to crystal strains and temperature variation. Mechanisms and regularities of forming of multi-beam X-ray intensity profiles on Kossel patterns, X-ray diffraction patterns of Renninger scans, and Kikuchi patterns (electron diffraction) were establish. Enhanced algorithms and soft-ware were developed. The technique for calculating and graphic presenting multi-beam patterns of Renninger scan in crystals were developed for multi-layered systems with the strain gradient on thickness

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Фодчук Ігор Михайлович
2. Fodchuk Igor Mykchaikovych

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.07

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Молодкін Вадим Борисович

2. Молодкін Вадим Борисович

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.07

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Остафійчук Богдан Костянтинович

2. Остафійчук Богдан Костянтинович

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.07

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Прокопенко Ігор Васильович

2. Прокопенко Ігор Васильович

Кваліфікація: к.ф.-м.н., 01.04.07

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради	Мельничук Степан Васильович
Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні	Мельничук Степан Васильович
Відповідальний за підготовку облікових документів	
Реєстратор	
Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності	Юрченко Т.А.